

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	-
10/674,358	SUGIYAMA ET AL.	
Examiner	Art Unit	-
Janis L. Dote	1756	

			<del></del>
	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
430	109.4° 137.1 137.17	2/3/07	Jy)
	137.18		
	137.19		
	110.4		
	124,10	81, 108.	4
399	119,25	2	
(us	PAT & US	SPGPUB)	
SEAR	CH UPD	ATED F	ROM
9	1/8/06		
_			

INT	ERFERENC	E SEARCH	ED
Class	Subclass	Date	Examiner
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<del></del>			
	<u> </u>		

(INCLUDING SEARCH	STRATEGY	<b>'</b> )
	DATE	EXMF
·		
	<del> </del>	<del> </del>
·		
·		•
•		
		:
	·	